



改正 RoHS セミナー

プログラム

- 開会あいさつ
13:30-13:35 日本電子株式会社 石原 勝俊 氏
- 改正 RoHS 指令の概要及びPY/TD-GC/MSによるフタル酸エステル類のスクリーニング分析
13:35-14:30 日本電子株式会社 小野寺 潤 氏
- 現場で使える蛍光X線装置の活用
14:30-14:50 日本電子株式会社 衣笠 元気 氏

《休憩》

14:50-15:00

- FT-IRによるフタル酸エステル類の検査法
15:00-15:30 日本分光株式会社 菅野 美幸 氏
- パイロライザーによるフタル酸エステル類のスクリーニング分析
- 日常の操作とメンテナンス、結果の正確さ、高速分析の提案 -
15:30-16:00 フロンティア・ラボ株式会社 鄭 甲志 氏
- 質疑応答とJSX-1000Sデモンストレーション
16:00-16:30

【お申込み・お問い合わせ先】

株式会社八戸インテリジェントプラザ
八戸市北インター工業団地一丁目4番43号
TEL0178-21-2111

※参加のお申し込みはメールでも受け付けております。
hayashizaki@hachinohe-ip.co.jp までご連絡ください。

平成
31年

2月1日 金

13:30-16:30 終了予定
(受付開始 13:00)

会 場

八戸インテリジェントプラザ
アイピーホール
受講無料



日本電子製X線分析装置JSX-1000Sによる、
分析をご希望の方は、**サンプル**をご持参下さい。



貴社（機関）名

(発信者氏名： TEL -)

申込締切 1/25

参加者	所属・氏名	E-mail	サンプル
			有 無
			有 無

FAX 0178-21-2119